

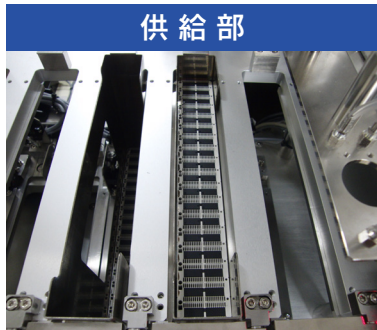
# タレット式多機能ハンドラ

パワー半導体パッケージの電気測定、外観検査、レーザマーク等の各種プロセスに対応した最適な装置を提案します。カスタム対応も行いますので、お気軽にお問い合わせください。



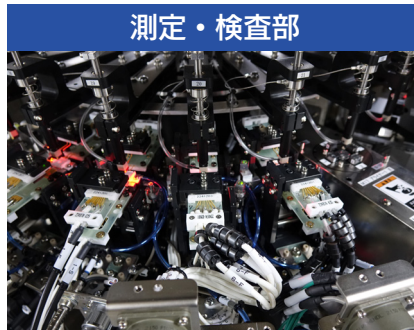
## 特 徴

- ・400Aのケルビンコンタクトが可能
- ・複数形態の供給・収納を搭載可能
- ・各種測定・検査を搭載可能
- ・高温測定の高速処理



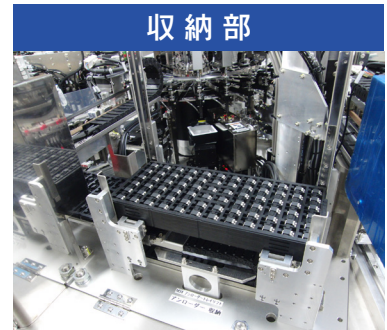
供給部

- ・リードフレーム (カット & フォーム)
- ・テープ ・トレイ
- ・チューブ ・マガジン
- ・パーツフィーダ



測定・検査部

- ・ケルビン測定 (8ステーション)
- ・各種画像検査 ・高温測定
- ・レーザマーク ・立体反転
- ・分類 (バラ、チューブ、テープ)
- ・インターブ検査



収納部

- ・テープ ・トレイ
- ・チューブ ・マガジン
- ・バラ

## 装置構成例

### リードフレーム供給、常温測定

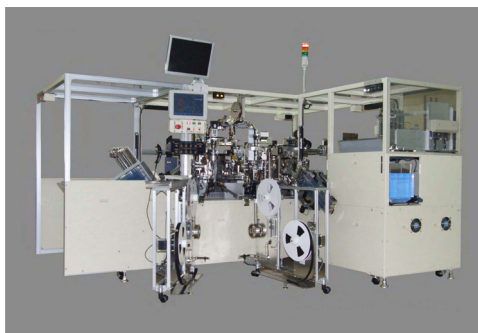


## 仕 様

型 式	TM288P
デバイス	SOP、SSOP、HSSOP 等
処理能力	0.55 秒 / 個 (テスト時間 0.45 秒含む)
供 給	・リードフレーム ・テープローダ
測 定	・4ステーション ・ケルビンコンタクト
レーザマーク	パッケージ上面
外観検査	・リード側面・上面 ・モールド上面、裏面
収 納	・マガジン：1 箇所 ・バラ NG：4 箇所 ・テープ：2 レーン

## 装置構成例

### チューブ供給、高温・常温測定



#### 仕様

型式	TH288LD
デバイス	SOP、SSOP、HSSOP 等
処理能力	0.5 秒 / 個 (テスト時間 0.25 秒含む)
供給	チューブ
測定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高温 2 ステーション</li> <li>・常温 6 ステーション</li> <li>・ケルビンコンタクト</li> </ul>
レーザマーク	—
外観検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リード側面・上面</li> <li>・モールド上面</li> <li>・裏面</li> </ul>
収納	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チューブ NG : 4 レーン</li> <li>・チューブ分類 : 15 レーン</li> <li>・テープ : 2 レーン</li> </ul>

### トレイ供給、常温測定



#### 仕様

型式	TM288P
デバイス	SOP、SSOP、HSSOP 等
処理能力	0.5 秒 / 個 (テスト時間 0.38 秒含む)
供給	トレイ、テープローダ
測定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5 ステーション</li> <li>・ケルビンコンタクト</li> </ul>
レーザマーク	パッケージ上面
外観検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リード側面・上面</li> <li>・モールド上面</li> <li>・裏面</li> </ul>
収納	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トレイ : 3 箇所</li> <li>・テープ : 3 レーン</li> </ul>